

DTSインサイトのRAMScopeとNI PXI LabVIEWを活用した制御ソフトウェア検証システム



NI PXIシステムをRAMScopeに統合することで、RAM値のモニタリングだけでなくアナログ入力や多様なデータも同時取得が可能です。またLabVIEWを使用することでユーザーフレンドリーなインターフェースを持ち、設定切り替えやデータの記録・分析が簡単に行うことができます。この3つを組み合わせることで機能を補完し、高精度な検証が可能になります。

システム概要

このシステムではデバイスからの信号取得(電気信号、RAM値、CANメッセージ)注入及びRAM値のモニタリングと書き換え、注入信号パターンの読み込み、試験設定の保存と読み込み、計測値やデータ処理の視覚化の機能を実行可能です。

製品のメリット

1. 効率的なテストプロセス

エンジニアはRAMScopeでリアルタイムにメモリ状態を監視し、PXIシステムでその他の必要なテストデータを同時に取得できます。

2. 包括的なデータ収集

アナログ入力やCAN通信などの、多様なデータの取得と分析が可能。

3. 生産性の向上

ソフトウェア開発と実際の基板設計の作業効率が向上し、プロジェクトの時間短縮とコスト削減に寄与します。

お問い合わせ先



TOKYO DENSAN

東京電機産業株式会社

Tokyo Denki Sangyo Co., Ltd.

〒151-0072

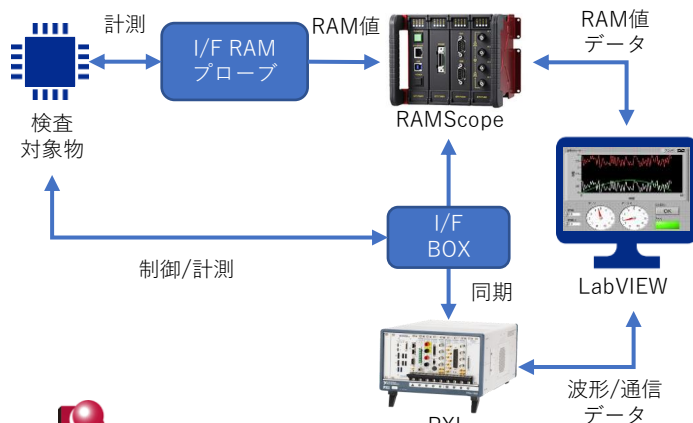
東京都渋谷区幡ヶ谷1-18-12

TEL:03-3481-1111

E-mail : solution@tokyo-densan.co.jp

URL : <https://www.tokyo-densan.co.jp/>

システムイメージ



RAMScope



RAMScopeは、制御ソフトウェアの検証における課題に対応します。制御アルゴリズムの変数変化を動的に計測し、制御モデルの挙動をリアルタイムで可視化します。

NI PXI



PXIはテストエンジニア用コンピュータです。計測性能の高さ、テスト時間の短縮、テスト全体のコスト削減が優れています。